

Životopis

Osobní data:

Jméno a příjmení: Milan Andrlé
Datum narození: 4. ledna 1975
Adresa bydliště: Hlavní 2532/133 Praha 4 – Spořilov
141 00
Národnost: česká
Rodinný stav: ženatý
Telefon: +420 606 784 322
E-mail: xandrlém@centrum.cz

Vzdělání:

1999 – 2002

Škola: ČVUT FEL Praha, Katedra měření – prezenční forma doktorského studia
Typ zakončení: obhajoba doktorské dizertační práce

1997 – 1999

Škola: ČVUT FEL Praha, Katedra měření – prezenční forma magisterského studia
Typ zakončení: obhajoba diplomové práce, státní závěrečná zkouška

1993 – 1997

Škola: ČVUT FEL Praha – prezenční forma bakalářského studia
Typ zakončení: obhajoba bakalářské práce

1989 – 1993

Škola: Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4
Typ zakončení: maturitní zkouška

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk: aktivně
Franzouzský jazyk: pasivně

Jiné znalosti a dovednosti:

Práce na PC:

- znalost práce na PC s operačními systémy Microsoft
- znalost práce s produkty MS Office Professional, tj. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
- dobrá orientace ve světě Interentu

Zájmy:

- česká novodobá historie

Pracovní zkušenosti:

květen 2003 – dosud

Zaměstnavatel: STMicroelectronics Design and Applications, s.r.o
Pozice:

- produktový inženýr, vedoucí skupiny AMS Product and Test Engineering Praha, vedoucí skupiny AMS Development Praha

**Adresa
zaměstnavatele:** Pobřežní 620/3, Praha 8
Tel: +420 222 336 175

září 1998 – květen 2003

Zaměstnavatel: Český metrologický institut
Pozice:

- pracovník sekundárního dělení elektrických veličin, pracovník primární laboratoře elektrického odporu

**Adresa
zaměstnavatele:** Radiová 3, Praha 10
Tel: +420 266 020 161

Publikace

Andrle, M., Haasz, V.: *ADC Test Using Filtering and Digital Correction*. XVI IMEKO World Congress IMEKO 2000 – EWADC'2000, Abteilung Austauschbau und Messtechnik, Wien 2000, vol.10, pp.15-19

Andrle, M., Haasz, V.: *Filters Design for ADC Testing*. *Proceedings of Workshop 2000*, Prague 2000, vol.A, pp. 178-179

Andrle, M., Holub, J., Vedral, J.: *ADC Testing by Means of Stochastic Signal*. ETW'01 IEEE European Test Workshop, Linköping 2001, pp.23-26

Andrle, M., Holub, J., Vedral, J.: *Histogram Test of Sigma-Delta ADC*. IMSTW'02 IEEE International Mixed Signal Testing Workshop, Montreux 2002, pp.197-200

Andrle, M., Holub, J., Vedral, J.: *Methods for Testing of High-Resolution ADC*. IMSTW'02 IEEE International Mixed Signal Testing Workshop, Montreux 2002, pp.193-196

Andrle, M., Holub, J., Vedral, J.: *Metrological Aspects of Digital Oscilloscopes*. Symposium digest of 18th Metrology Symposium 2001, Cavtat 2001, pp.36-39

Andrle, M., Holub, J., Vedral, J., Al-Iriany, K.: *Time versus Frequency – Domain Methods for High Resolution ADC Testing*. ETW'02 IEEE European Test Workshop, Corfu 2002, pp.219-220

Andrle, M., Vedral, J.: *Testing of High Resolution AD Converters*. *Proceedings of Workshop 2002*, Prague 2002, pp.438-439

Andrle, M., Vedral, J., Holub, J., Šmid, R.: *High Resolution ADC Testing by Means of Standard Test Methods*. DDECS – IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Brno 2002, pp.366-369

Andrle, M., Vedral, J., Holub, J., Štindl, P.: *Measuring System for Testing of Digital Oscilloscopes*. *Proceeding of Workshop 2001*, Prague 2001, vol.A, pp.344-345

Boháček J., Andrle M.: *Calibration of Multi-decade Inductive Voltage Dividers*. XVI IMEKO World Congress 2000, Vienna, Austria, 25-28 Sept., 2000, vol. V., pp. 233-237.

Vedral, J., Holub, J., Andrle, M., Al-Iriany, K.: *Testing of Digital Oscilloscopes*. Applied Electronics 2000, Plzeň 2000, pp.179-182

Haasz, V. Andrle, M., Brossmann, J., Holub, J., Roztočil, J.: *Nové výsledky v testování dynamických charakteristik AČ modulů*. KTEM 2000 Seminář kateder teoretické elektrotechniky a měření elektrotechnických fakult České republiky a Slovenské republiky, Praha 2000, pp.33-39